

令和8年度 評価技術講習会 — 異物分析・におい分析・微量分析 — 第3回「異物分析」シリーズ 蛍光X線分析法

（地独）京都市産業技術研究所では、地域企業の技術者や大学の研究者の皆様が、材料分析の基礎を体系的に学べる講習会を開催しています。令和8年度は、「異物分析」、「におい分析」、「微量分析」の3つのテーマを設定いたしました。本講習会では、「測定データの見方」など基礎的な事例紹介と共に、先進機器などによるデモ測定を行いながら分かりやすく解説します。

第3回は、「異物分析」シリーズ 蛍光X線分析法です。

本講習会の受講を機に、弊所が保有する機器と技術を積極的にご活用いただくよう、お願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。

記

日 時 令和8年9月17日(木) 14:00 ～ 16:00

【講義】14:00 ～ 14:45 【実習】15:00 ～ 16:00

※講義のみハイブリッド形式（Zoom）

会 場 （地独）京都市産業技術研究所

（〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町91 京都リサーチパーク9号館南棟）

【講義】5階講義室B 及び Web形式（Zoom）

【実習】2階 X線機器分析室

内 容 令和8年度 評価技術講習会 —異物分析・におい分析・微量分析—

第3回：「異物分析」シリーズ 蛍光X線分析法

【講義】蛍光X線分析法の基礎

【実習】蛍光X線分析法の試料準備、デモ測定、測定データの解析など

講師：（地独）京都市産業技術研究所 材料・素材技術グループ 山梨 眞生

<蛍光X線分析法>

蛍光X線分析法は、X線を照射した際に試料から発生する蛍光X線を検出することにより、試料に含まれる元素の種類や量（組成）を知ることができる手法です。難しい前処理を行うことなく、非破壊的に試料の組成分析ができるため、金属や半導体、繊維材料のような幅広い分野で受入れ検査や異物分析に利用されています。



令和5年度（公財）JKA 機械設備拡充補助事業（競争補助事業）設置機器



リガク ZSX Primus IV

- 対 象**
- ・企業技術者、大学の研究者など材料分析法を基礎から学びたい方
 - ・分析は外部委託しているが、測定原理から学びたい方
 - ・測定経験はあるが、試料前処理及び測定などを再確認したい方など

- 定 員**
- ・対面形式（講義及び実習）：7名
 - ・Web形式（講義のみ）：50名程度
- ※対面形式は1社1名、応募多数の場合は抽選
- ※抽選は、京都市産業技術研究所ユーザーズコミュニティ会員優先



参加申込フォーム

参加費 無料

募集期間 令和8年8月17日(月)～令和8年9月4日(金)

申込方法 (地独)京都市産業技術研究所の参加申込フォームからお申し込みください。

参加申込フォーム：<https://form.run/@R08-Hyoka-03>

令和8年9月10日(木)までに、登録メールアドレスに結果をお知らせします。

主 催 (地独)京都市産業技術研究所

問合せ先 (地独)京都市産業技術研究所

担当：製品化・人材育成支援グループ 南・島村、経営企画室 土田

評価技術講習会ページ：<https://tc-kyoto.or.jp/hyokagijutukoshu/>

TEL：075-326-6100（代）、E-mail：kikiseminar（ato）tc-kyoto.or.jp

※メールをお送りいただく際は、（ato）を@に変えてください。

開催にあたっての注意事項

- ・インターネット環境、動画視聴環境、パソコン等の設定方法につきましては、システム、OS ごとに異なりますので、事前にご確認をお願いします。
- ・申し込みされた方には、メールにてご連絡いたします。tc-kyoto.or.jp の登録をお願いいたします。
- ・講演会開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
- ・申し込みされた方の確認のため、Zoom 接続時には必ず申込み時の接続時の名前をご使用ください。また、本セミナーは、ウェビナー機能を利用しませんので、接続時の名前がZoom 上に表示されます。あらかじめご了承ください。
- ・本講演会で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止します。
- ・会場へのアクセスは、右地図及び産技研アクセスページをご参照ください。
産技研アクセスページ：<https://tc-kyoto.or.jp/aboutus/#access>

